

NORME
INTERNATIONALE

CEI
IEC

INTERNATIONAL
STANDARD

60747-3-1

QC 750001

Première édition
First edition
1986-07

**Dispositifs à semiconducteurs –
Dispositifs discrets**

**Troisième partie: Diodes de signal (y compris les
diodes de commutation) et diodes régulatrices**
Section un – Spécification particulière cadre pour
les diodes de signal, les diodes de commutation
et les diodes à avalanche contrôlée

**Semiconductor devices –
Discrete devices**

**Part 3: Signal (including switching) and
regulator diodes**

Section One – Blank detail specification for
signal diodes, switching diodes and
controlled-avalanche diodes

© IEC 1986 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun
procédé, électronique ou mécanique, y compris la photo-
copie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in
any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission in
writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

L

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS

Dispositifs discrets

**Troisième partie: Diodes de signal (y compris les diodes de commutation)
et diodes régulatrices**

**Section un – Spécification particulière cadre pour les diodes de signal,
les diodes de commutation et les diodes à avalanche contrôlée**

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été préparée par le Comité d'Études n° 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Cette norme est une spécification particulière cadre pour les diodes de signal, les diodes de commutation et les diodes à avalanche contrôlée.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
47(BC)896	47(BC)939

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau ci-dessus.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spécification dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

- Publications n°s 68-2-17 (1978): Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique, Deuxième partie: Essais, Essai Q: Etanchéité.
- 191-2 (1966): Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs, Deuxième partie: Dimensions.
- 747-3 (1985): Dispositifs à semiconducteurs – Dispositifs discrets – Troisième partie: Diodes de signal (y compris les diodes de commutation) et diodes régulatrices.
- 749 (1984): Dispositifs à semiconducteurs – Essais mécaniques et climatiques.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices

Part 3: Signal (including switching) and regulator diodes

**Section One – Blank detail specification for signal diodes, switching diodes
and controlled-avalanche diodes**

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 47: Semiconductor Devices.

This standard is a blank detail specification for signal diodes, switching diodes and controlled-avalanche diodes.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
47(CO)896	47(CO)939

Further information can be found in the Report on Voting indicated in the table above.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Other IEC publications quoted in this standard:

- Publications Nos. 68-2-17 (1978): Basic Environmental Testing Procedures, Part 2: Tests, Test Q: Sealing.
- 191-2 (1966): Mechanical Standardization of Semiconductor Devices, Part 2: Dimensions.
- 747-3 (1985): Semiconductor Devices – Discrete Devices – Part 3: Signal (including Switching) and Regulator Diodes.
- 749 (1984): Semiconductor Devices – Mechanical and Climatic Test Methods.

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets

**Troisième partie: Diodes de signal (y compris les diodes de commutation)
et diodes régulatrices**

**Section un – Spécification particulière cadre pour les diodes de signal,
les diodes de commutation et les diodes à avalanche contrôlée**

INTRODUCTION

Le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques fonctionne conformément aux statuts de la CEI et sous son autorité. Le but de ce système est de définir les procédures d'assurance de la qualité de telle façon que les composants électroniques livrés par un pays participant comme étant conformes aux exigences d'une spécification applicable soient également acceptables dans les autres pays participants sans nécessiter d'autres essais.

Cette spécification particulière cadre fait partie d'une série de spécifications particulières cadres concernant les dispositifs à semiconducteurs; elle doit être utilisée avec les publications suivantes de la CEI:

- 747-10/QC 700000 (1984): Dispositifs à semiconducteurs, Dixième partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets et les circuits intégrés;
- 747-11/QC 750000 (1985): Dispositifs à semiconducteurs, Onzième partie: Spécification intermédiaire pour les dispositifs discrets.

SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices

Part 3: Signal (including switching) and regulator diodes

**Section One – Blank detail specification for signal diodes, switching diodes
and controlled-avalanche diodes**

INTRODUCTION

The IEC Quality Assessment System for Electronic Components is operated in conformance with the statutes of the IEC and under the authority of the IEC. The object of this system is to define quality assessment procedures in such a manner that electronic components released by one participating country as conforming with the requirements of an applicable specification are equally acceptable in all other participating countries without the need for further testing.

This blank detail specification is one of a series of blank detail specifications for semiconductor devices and shall be used with the following IEC publications:

- 747-10/QC 700000 (1984): Semiconductor Devices, Part 10: Generic Specification for Discrete Devices and Integrated Circuits.
- 747-11/QC 750000 (1985): Semiconductor Devices, Part 11: Sectional Specification for Discrete Devices.